



Instituto de  
Investigaciones  
en Materiales



## Programa

### Encuentro de Microscopía Electrónica – XXXV Aniversario de JEOL de México

Horario	Ponente	Charla
9:00 - 9:15	Mensaje por parte de Izumi Oi, Presidente y CEO de JEOL Ltd.	
	Bienvenida por parte de directivos de JEOL de México e Instituto de Investigaciones en Materiales	
9:15 - 9:45	PhD. Tim Eldred <i>JEOL USA</i>	JEOL's Advancements in Workflow and Experimental Design
9:45 - 10:15	Kevin McIlwrath <i>JEOL USA</i>	4D STEM
10:15 - 10:45	PhD. Jennifer McConnell <i>Protochips</i>	Using in situ TEM techniques to improve battery and electronic device performance.
10:45 - 11:00	Coffe break	
11:00 - 11:30	David Edwards <i>JEOL USA</i>	Low Vacuum Hybrid SED
11:30 - 12:00	PhD. Jennifer Misuraca <i>JEOL USA</i>	High-Resolution, Low Voltage SEM Imaging for Advancing Materials Research
12:00 - 12:30	PhD. Kayleigh Harvey <i>JEOL USA</i>	Next-generation Soft X-ray Analysis: Soft X-ray Emission Spectrometer & Gather-X Windowless EDS
12:30 - 13:10	Lunch	
13:10 - 13:50	Dr. Gabriel Torres Villaseñor <i>Profesor Emérito</i> <i>Instituto de Investigaciones en Materiales</i>	La microscopía electrónica en México: Sus inicios y situación actual
13:50 - 14:10	Dr. José Reyes <i>Instituto de Física UNAM</i>	El microscopio electrónico de transmisión JEOL 100CX en el Instituto de Física de la UNAM
14:10 - 14:30	Dr. Jesus Angel Arenas Alatorre <i>Instituto de Física UNAM</i>	Impacto de las tecnologías SEM y TEM de JEOL en la infraestructura científica mexicana (1991-2026)
14:30 - 15:10	Dr. José Gonzalo González Reyes <i>Profesor Titular C</i> <i>Instituto de Investigaciones en Materiales</i>	Cristalografía por difracción de electrones: determinación del sistema cristalino y clase de Laue
15:10 - 15:25	Coffe break	
15:25 - 15:45	Dr. Paz Del Angel Vicente <i>Instituto Mexicano del Petróleo</i>	Seis décadas de microscopía electrónica en el IMP y su impacto en la industria petrolera mexicana.
15:45 - 16:05	Dr. Hugo Martínez Gutierrez Dr. Raúl Borja Urby <i>CNMMyN IMP</i>	El impulso JEOL: 13 años de técnica e infraestructura científica en los laboratorios de microscopía electrónica del CNMN-IPN
16:05 - 16:25	Dr. Guillermo Acosta <i>Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM</i>	Análisis de la estructura y composición en gris grafito y azul maya, dos nanotecnologías precolombinas
16:25 - 16:45	Dr. Jaime Santoyo Salazar <i>Cinvestav Zacatenco</i>	Explorado el mundo nano en la teranóstica, ¡¡¡Gracias a JEOL!!!
16:45 - 17:05	Dr. César Leyva <i>CIMAV Chihuahua</i>	Tecnología, formación y consolidación científica en México: 31 años de colaboración entre CIMAV y JEOL de México
17:05 - 17:25	Dr. Daniel Bahena Uribe <i>Cinvestav Zacatenco.</i>	Otto Scherzer: Padre la aberración esférica corregida, de la teoría a la imagen.
17:25 - 17:45	Dr. Arturo Ponce Pedraza <i>-University of Texas at San Antonio</i> <i>-Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)</i>	Building a Career in Electron Microscopy: Lessons from 25 Years with JEOL Systems
17:45 - 18:00	Palabras de cierre del Instituto de Investigaciones en Materiales y JEOL	